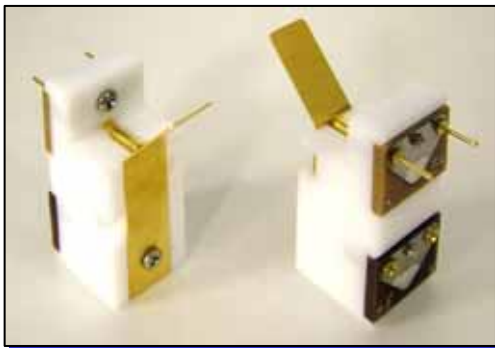


- 自動化されたソフトウェアによる
コンポーネント用温度テストシステムです。
- システムは、コンデンサ、インダクタ、抵抗、
ダイオードまたはトランジスタ テストのために
構成されます。
- 標準的なテストとしては、サンプリングテスト、
最終品質管理 (QC) テストと新規コンポーネント
の評価があります。
- 開放、短絡と読み込みのキャリブレーション、
絶縁されたキャリア、ケルビン接続と
正確な測定を行うためのシールドケーブルを
備えております。
- テストホイールは、軸、半径に関してや
チップコンデンサと様々な他の特別な
配列タイプのデバイスに適用します。



テフロンで絶縁されたチップキャリア

- 分類やグループ分け機能を含んだユーザー
定義された品質管理の制限と共にテスト
パラメータを選択できます。
- 全てのデータは、Microsoft Access™ データベース
で公開され、カスタムデータ解析のために
Microsoft Excel™ でエクスポートが可能です。
- Crystal Reports® を使用した印刷出力が可能です。
- ネットワークを通してテスト結果の共有が可能です。

仕様

温度範囲:

-55° C から 150° C

温度の安定性:

+/- 0.1° C

サンダースジャパン株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 芝パークビル10F Tel 03-5777-9177 Fax 03-5401-8774
E-mail: japansales@saunders-assoc.com World Wide Web <http://www.saunders-assoc.com>

システム構成

- S&A 4220 温度テストチャンバー (CO₂, LN₂, またはメカニカル冷却)
- 測定オプション (下記のリストを参照)
- Windows XPを搭載したパソコン
- システムソフトウェア

測定オプション

- コンデンサ / インダクタ テストシステム
 - 計測装置: LCR Bridge, 高圧電源
 - 測定の例: C, D, Q, L, CTC, LTC, VにおけるC, VにおけるL
- 絶縁抵抗 テストシステム
 - 計測装置: Picoam メーター, 高圧電源
 - 測定の例: I, IR
- 抵抗 テストシステム
 - 計測装置: デジタル マルチメーター
 - 測定の例: R, RTC
- ダイオード テストシステム
 - 計測装置: ソースメーター, 2473 マルチプレクサ
 - 測定の例: VF, VR, VB, IF, IR, IP
- トランジスタ テストシステム
 - 計測装置: Lorlin または FEC インターフェース
 - 測定の例: 仕分け番号
- 組み合わせとカスタムシステムの利用が可能

サンプルレポート

